

## 特 許 協 力 条 約

P C T

国際予備審査報告

REC'D 17 OCT 2003

WIPO

PCT

(法第12条、法施行規則第56条)

〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 PH-1748-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/03528	国際出願日 (日.月.年) 24.03.03	優先日 (日.月.年)
国際特許分類(IPC) Int. Cl. <sup>7</sup> G01N21/27 ; G01N21/03		
出願人(氏名又は名称) 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。

☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。

(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)

この附属書類は、全部で ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

I ☒ 国際予備審査報告の基礎II ☐ 優先権III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成IV ☒ 発明の単一性の欠如V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明VI ☐ ある種の引用文献VII ☐ 国際出願の不備VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 24.03.03	国際予備審査報告を作成した日 30.09.03	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 樋口 宗彦	2W 9118
	電話番号 03-3581-1101 内線 3290	

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査（または調査）機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査（または調査）機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## IV. 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2 ☒ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1-12は、複数ウェルを一括撮像して各ウェルの吸光度を分析する読み取り装置・方法に関する発明である。  
一方、請求の範囲13-15は、請求項1-12に係る装置・方法以外も含む一般的な吸光度読み取りに供するマイクロチャンバーアレイの構造に関する発明である。

4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。

- ☒ すべての部分
- ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ に関する部分

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	3, 5-12	有
	請求の範囲	1, 2, 4, 13-15	無
進歩性(IS)	請求の範囲	9	有
	請求の範囲	1-8, 10-15	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-15	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 2002-510036 A (アパシス・ファーマ・ド・イチュアント・ゲセ・ルシャフト・ミット・ヘ・シュレンクテル・ハフツング) & WO 99/49973 A  
 文献2: JP 2001-512875 A (イメージング リサーチ、インク.) & WO 99/08233 A  
 文献3: JP 2002-525600 A (セロミックス インコーポレイテッド) & WO 00/17624 A  
 文献4: JP 61-262639 A (オリンパス光学工業株式会社)  
 文献5: JP 8-304177 A (日電電機株式会社)  
 文献6: JP 6-323990 A (京都電子工業株式会社)  
 文献7: JP 47-45894 A (ホーテン・ヘル・ル・ハーケン・エルマー・ウント・コンパニイ・ゲセ・ルシャフト・ミット・デ・ン・ヘ・シュレンクテル・ハフツング)  
 文献8: JP 1-307645 A (大日本印刷株式会社)  
 文献9: JP 5-302893 A (株式会社島津製作所)  
 文献10: JP 2001-108525 A (株式会社島津製作所)  
 文献11: JP 8-193945 A (株式会社島津製作所)

請求の範囲13-15 / 文献1, 3 /

文献1には、マイクロチャンバーアレイに於ける1ウェルの直径を1mm、ウェル中心距離を2.25mm (ウェル間距離1.25mmに相当)、ウェル数1000~4000とすることが記載されている(段落6, 10)。

文献3には、マイクロチャンバーアレイに於いて0.02~2mmのウェルサイズ、ウェル間距離0.125~3mm、ウェル数20~6400/cm<sup>2</sup>とすることが記載されている(段落152-169)。

該請求の範囲に於いて限定された数値範囲は、上記各文献に記載された数値範囲に含まれるか、または隣接するものであり、該各請求の範囲に係る発明は新規性を有さない。

請求の範囲1, 2, 4 / 文献2 /

文献2には、マイクロチャンバーアレイに対する透過、蛍光、発光分析に共用可能(段落41)な測定光学系として、光源、波長選択手段、均等照明手段(p19(段落42))、受光用テレセントリック光学系、撮像カメラからなる一括撮像手段が記載されている。ここで、一括撮像であるから撮像手段視野内に納まるウェルであれば撮像は瞬時に完了し、「1分以内」が達成可能であることは自明である。したがって、該各請求の範囲に係る発明は新規性を有さない。

請求の範囲3, 11 / 文献1-3 /

文献3の段落137には、マイクロチャンバーアレイに於いて、流体の回収機構を設けることが記載されている。

請求の範囲5 / 文献1-4 /

文献4のp4右下欄~p5左下欄にかけて、マルチチャンバーアレイに対する吸光度測定に於いて、各チャンパーに対して順次波長走査を行う測定モード、同一の1項目について連続的に分析する測定モード(即ち、一波長について時系列測定を行うことを意味する)などを適宜切替、プログラミング可能とすることが記載されている。

請求の範囲6 / 文献1-3, 5, 6, 10, 11 /

文献5, 6には、光学分析装置に於いて露光時間を手動、自動にて調節可能とする周知技術が、文献9, 10には、分光分析装置に於いて、波長分解能や測定波長範囲について調節可能とする周知技術が、それぞれ記載されており、該請求の範囲に於ける限定事項は該各周知技術とかわりがなく、その適用は当業者にとって容易である。

請求の範囲7, 8, 12 / 文献1-3, 5-7, 10, 11 /

マルチチャンバーアレイに対する一括撮像分析に於いて、チャンパーアレイの一角に基準用の光路を設け、該

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

基準用光路の透過光測定値で他の未知試料の吸光度を補正するようにデータ処理することは文献7に記載されている。なお、基準用光路を基準チャンバーで形成するか光源光モニター用光路としてこうせいするかは補正用途に応じて適宜選択されるべきものに過ぎない。

請求の範囲10/文献1-3、5-7、9、10、11/  
吸光分光分析装置に於いて、セルについて光路長の補正を行うことは文献9に記載された通りの周知技術である。